

適用規格																												
定 格	使用温度範囲	-45℃～ +125℃（注1）		保存温度範囲	-10℃～ +60℃（注2）																							
	電 圧	AC 50 V		適合コネクタ	DF12#-*DS-0.5V(81)																							
	電 流	0.3 A			DF12#-*DS-0.5V(86)																							
性 能																												
	項 目	試 験 方 法		規 格		QT	AT																					
構造	外観,構造,仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。		○	○																					
	表示	目視にて確認する。				○	○																					
電氣的性能	接触抵抗	100 mA(DC又は 1000 Hz)で測定する。		50 mΩ以下		○	—																					
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。		500 MΩ以上		○	—																					
	耐電圧	AC 150 Vの電圧を 1 分間印加する。		せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	—																					
機械的性能	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。		<table><tr><td>極数</td><td>挿入力(N)以下</td><td>抜去力(N)以上</td></tr><tr><td>20</td><td>23.4</td><td>2.6</td></tr><tr><td>30</td><td>27.0</td><td>3.4</td></tr><tr><td>36</td><td>29.0</td><td>4.0</td></tr><tr><td>40</td><td>30.6</td><td>4.2</td></tr><tr><td>50</td><td>34.2</td><td>5.0</td></tr><tr><td>60</td><td>38.0</td><td>6.0</td></tr></table>		極数	挿入力(N)以下	抜去力(N)以上	20	23.4	2.6	30	27.0	3.4	36	29.0	4.0	40	30.6	4.2	50	34.2	5.0	60	38.0	6.0	○	—
	極数	挿入力(N)以下	抜去力(N)以上																									
	20	23.4	2.6																									
	30	27.0	3.4																									
	36	29.0	4.0																									
	40	30.6	4.2																									
	50	34.2	5.0																									
60	38.0	6.0																										
繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。		①接触抵抗：50 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—																						
耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。		① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—																						
耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。		① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—																						
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。		①接触抵抗：50 mΩ以下 ②絶縁抵抗：500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—																					
	温度サイクル	温度 -65 → 5～35 → 125 → 5～35℃ 時間 30 → 10～15 → 30 → 10～15分 を 5 サイクル 試験する。		①接触抵抗：50 mΩ以下 ②絶縁抵抗：500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—																					
	半田耐熱性	【 リフロー半田付けの場合 】 《 リフロー部 》 MAX 250℃ピーク 220℃以上 60 秒 以内 《 予熱部 》 150～180℃ 90 ～120 秒 リフローは同条件にて2回まで可能 【 手半田（リペア）の場合 】 半田ごてで 350℃、3 秒の条件にて半田付けを行 う。但し、端子に力を加えないこと。		外観の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。		○	—																					
	二酸化硫黄	濃度10 ppm、96 時間放置する。 （試験規格： J E I D A - 3 9）		①接触抵抗：50 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。		○	—																					
	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水、48 時間放置する。		①接触抵抗：50 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。		○	—																					
備考																												
(注1)通電時の温度上昇を含みます。																												
(注2)保存とは基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表し、基板搭載後の無通電状態は 使用温度範囲が適用されます。																												
試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5402を適用しています。																												
	△の数	訂正記事		設計		検図	年月日																					
△																												
				承認	MO.NAKAMURA	06.01.30																						
				検 図	TS.MIYAZAKI	06.01.30																						
				担 当	YH.MICHIDA	06.01.30																						
				製 図	HK.MURAKAMI	06.01.30																						
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目				図番	SLC4-162287-09																							
HRS	製 品 規 格 表			製品名	DF12D(3.5)-*DP-0.5V(81)																							
	ヒロセ電機株式会社			製品コード	CL537	△	1/1																					